

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Caractéristiques des circuits CMOS Formules

[calculatrices !](#)[Exemples!](#)[conversions !](#)

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**

Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**

La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**



N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis  
!

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)



# Liste de 15 Caractéristiques des circuits CMOS Formules

## Caractéristiques des circuits CMOS ↗

### 1) Capacité effective en CMOS ↗

**fx**  $C_{\text{eff}} = D \cdot \frac{i_{\text{off}} \cdot (10^{V_{bc}})}{N_g \cdot [\text{BoltZ}] \cdot V_{bc}}$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $5.137895\mu\text{F} = 1.3\text{E}^{-25} \cdot \frac{0.01\text{mA} \cdot (10^{2.02\text{V}})}{0.95 \cdot [\text{BoltZ}] \cdot 2.02\text{V}}$

### 2) Champ électrique critique ↗

**fx**  $E_c = \frac{2 \cdot V_{\text{sat}}}{\mu_e}$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $0.004064\text{V/mm} = \frac{2 \cdot 10.12\text{mm/s}}{49.8\text{cm}^2/\text{V*s}}$

### 3) CMOS Moyenne Parcours Libre ↗

**fx**  $L = \frac{V_c}{E_c}$

Ouvrir la calculatrice ↗

**ex**  $697.5\text{mm} = \frac{2.79\text{V}}{0.004\text{V/mm}}$



**4) Épaisseur de la couche d'oxyde** ↗

**fx**  $t_{ox} = \varepsilon_{ox} \cdot W_g \cdot \frac{L_g}{C_{in}}$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $4.979688\text{mm} = 149.79\mu\text{F}/\text{mm} \cdot 0.285\text{mm} \cdot \frac{7\text{mm}}{60.01\mu\text{F}}$

**5) Largeur de diffusion de la source** ↗

**fx**  $W_s = \frac{A_s}{D_s}$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $89.81967\text{mm} = \frac{5479\text{mm}^2}{61\text{mm}}$

**6) Largeur de la porte** ↗

**fx**  $W_g = \frac{C_{in}}{C_{ox} \cdot L_g}$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $0.285667\text{mm} = \frac{60.01\mu\text{F}}{30.01\mu\text{F}/\text{mm}^2 \cdot 7\text{mm}}$

**7) Largeur de la région d'appauvrissement** ↗

**fx**  $L_d = L_{pn} - L_{eff}$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $11\text{mm} = 19\text{mm} - 8\text{mm}$



**8) Largeur de transition du CMOS** ↗

$$fx \quad W = \frac{C_{\text{mos}}}{C_{\text{gs}}}$$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

$$ex \quad 89.82036\text{mm} = \frac{1.8\mu\text{F}}{20.04\mu\text{F}}$$

**9) Longueur de jonction PN** ↗

$$fx \quad L_{\text{pn}} = L_d + L_{\text{eff}}$$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

$$ex \quad 19.01\text{mm} = 11.01\text{mm} + 8\text{mm}$$

**10) Longueur effective du canal** ↗

$$fx \quad L_{\text{eff}} = L_{\text{pn}} - L_d$$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

$$ex \quad 7.99\text{mm} = 19\text{mm} - 11.01\text{mm}$$

**11) Périmètre de la paroi latérale de diffusion de la source** ↗

$$fx \quad P_s = (2 \cdot W) + (2 \cdot D_s)$$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

$$ex \quad 301.64\text{mm} = (2 \cdot 89.82\text{mm}) + (2 \cdot 61\text{mm})$$



**12) Permittivité de la couche d'oxyde** ↗

**fx**  $\epsilon_{\text{ox}} = t_{\text{ox}} \cdot \frac{C_{\text{in}}}{W_g \cdot L_g}$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $149.7994 \mu\text{F}/\text{mm} = 4.98\text{mm} \cdot \frac{60.01 \mu\text{F}}{0.285\text{mm} \cdot 7\text{mm}}$

**13) Tension au minimum EDP** ↗

**fx**  $V_{\text{edp}} = \frac{3 \cdot V_t}{3 - \alpha}$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $0.666667\text{V} = \frac{3 \cdot 0.3\text{V}}{3 - 1.65}$

**14) Tension critique CMOS** ↗

**fx**  $V_c = E_c \cdot L$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $2.79028\text{V} = 0.004\text{V}/\text{mm} \cdot 697.57\text{mm}$

**15) Zone de diffusion de la source** ↗

**fx**  $A_s = D_s \cdot W$

**Ouvrir la calculatrice** ↗

**ex**  $5479.02\text{mm}^2 = 61\text{mm} \cdot 89.82\text{mm}$



# Variables utilisées

- $\mu_e$  Mobilité de l'électron (*Centimètre carré par volt seconde*)
- $A_s$  Zone de diffusion de la source (*Millimètre carré*)
- $C_{eff}$  Capacité effective en CMOS (*microfarades*)
- $C_{gs}$  Capacité de la porte MOS (*microfarades*)
- $C_{in}$  Capacité de la porte d'entrée (*microfarades*)
- $C_{mos}$  Capacité de chevauchement de porte MOS (*microfarades*)
- $C_{ox}$  Capacité de la couche d'oxyde de grille (*Microfarad par millimètre carré*)
- $D$  Cycle de service
- $D_s$  Longueur de la source (*Millimètre*)
- $E_c$  Champ électrique critique (*Volt par millimètre*)
- $i_{off}$  Hors courant (*Milliampère*)
- $L$  Libre parcours moyen (*Millimètre*)
- $L_d$  Largeur de la région d'épuisement (*Millimètre*)
- $L_{eff}$  Longueur effective du canal (*Millimètre*)
- $L_g$  Longueur de la porte (*Millimètre*)
- $L_{pn}$  Longueur de jonction PN (*Millimètre*)
- $N_g$  Portes sur le chemin critique
- $P_s$  Périmètre de paroi latérale de diffusion de la source (*Millimètre*)
- $t_{ox}$  Épaisseur de la couche d'oxyde (*Millimètre*)
- $V_{bc}$  Tension du collecteur de base (*Volt*)



- $V_c$  Tension critique dans CMOS (*Volt*)
- $V_{edp}$  Tension à l'EDP minimum (*Volt*)
- $V_{sat}$  Saturation de la vitesse (*Millimètre / seconde*)
- $V_t$  Tension de seuil (*Volt*)
- $W$  Largeur de transition (*Millimètre*)
- $W_g$  Largeur du portail (*Millimètre*)
- $\alpha$  Facteur d'activité
- $\epsilon_{ox}$  Permittivité de la couche d'oxyde (*Microfarad par millimètre*)



# Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** [BoltZ], 1.38064852E-23 Joule/Kelvin  
*Boltzmann constant*
- **La mesure:** Longueur in Millimètre (mm)  
*Longueur Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Courant électrique in Milliampère (mA)  
*Courant électrique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Zone in Millimètre carré (mm<sup>2</sup>)  
*Zone Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** La rapidité in Millimètre / seconde (mm/s)  
*La rapidité Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Capacitance in microfarades ( $\mu\text{F}$ )  
*Capacitance Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Intensité du champ électrique in Volt par millimètre (V/mm)  
*Intensité du champ électrique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Potentiel électrique in Volt (V)  
*Potentiel électrique Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Mobilité in Centimètre carré par volt seconde (cm<sup>2</sup>/V\*s)  
*Mobilité Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Capacité d'oxyde par unité de surface in Microfarad par millimètre carré ( $\mu\text{F}/\text{mm}^2$ )  
*Capacité d'oxyde par unité de surface Conversion d'unité* ↗
- **La mesure:** Permittivité in Microfarad par millimètre ( $\mu\text{F}/\text{mm}$ )  
*Permittivité Conversion d'unité* ↗



## Vérifier d'autres listes de formules

- Sous-système de chemin de données de tableau Formules ↗
- Caractéristiques des circuits CMOS Formules ↗
- Caractéristiques du retard CMOS Formules ↗
- Caractéristiques de conception CMOS Formules ↗
- Mesures de puissance CMOS Formules ↗
- Sous-système CMOS à usage spécial Formules ↗
- Caractéristiques temporelles CMOS Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

## PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 8:28:52 PM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

